Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent unde Reexamination	r
10/632,796	YI ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Hai C. Pham	2861	

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
347	241-242, 244, 256- 258	7/18/2005	НР
;			
-		<u>-</u>	
	-		
			,

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
347	244, 258	7/18/2005	НР
			,
	·!.		
3		:	

SE (INCLUDIN)	ARCH NOTE SEARCH S	ES STRATEGY))
		DATE	EXMR
EAST		7/18/2005	HP
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			